

УДК 621.315.592

О фотоэлектрическом усиении варизонными фоторезисторами

© В.Г. Савицкий, Б.С. Соколовский

Львовский государственный институт им. Ив. Франко,
290602 Львов, Украина

(Получена 6 декабря 1995 г. Принята к печати 26 января 1995 г.)

Теоретически рассмотрены особенности фотоэлектрического усиления варизонных фоторезисторов с линейно увеличивающейся к контактам шириной запрещенной зоны. Показано, что в таких фоторезисторах реализуется немонотонная полевая зависимость коэффициента фотоэлектрического усиления, максимальное значение которого увеличивается с ростом градиента ширины запрещенной зоны и может существенно превышать соответствующее значение для однородных образцов.

Одной из главных причин, препятствующих повышению чувствительности биполярных фоторезисторов (ФР) с малыми геометрическими размерами за счет увеличения напряженности смещения, является эффект вытягивания (эксклюзии) неравновесных носителей заряда [1–3]. В условиях проявления эффекта вытягивания photoносителей эффективное время жизни последних τ_{eff} уменьшается с ростом приложенного к ФР напряжения, что ведет к насыщению в сильных электрических полях коэффициента фотоэлектрического усиления (КФУ) G , причем в случае однородного полупроводника n -типа максимальное значение КФУ $G_0^{\max} = (1 + b)/2$, где $b = \mu_n/\mu_p$ — отношение подвижностей электронов и дырок [1]. Поэтому поиск путей устранения или уменьшения эффекта вытягивания photoносителей представляет важную задачу при разработке ФР. К настоящему времени предложен ряд способов увеличения КФУ фоторезисторов, в частности создание возле омического контакта резкого изотипного гомо- или гетероперехода [4–6], слоисто-неоднородное легирование полупроводника [7,8]. В данном сообщении теоретически доказывается возможность увеличения КФУ фоторезистора за счет немонотонного координатного изменения ширины запрещенной зоны E_g .

Рассмотрим простую модель варизонного ФР n -типа проводимости, в котором $E_g(x)$ линейно уменьшается от контактов ($x = \pm d$) к середине ФР ($x = 0$), причем $E_g(-d) = E_g(d)$. Координатное распределение концентрации избыточных дырок Δp и электронов Δn ($\Delta n \approx \Delta p$), устанавливающееся в освещенном ФР при приложении к нему внешнего электрического поля $\mathbf{E}(E_x, 0, 0)$, описывается уравнениями [9,10]

$$\frac{d^2 \Delta p}{dx^2} - \frac{1}{kT} \left(eE_x \pm \left| \frac{dE_g}{dx} \right| \right) \frac{d\Delta p}{dx} - \frac{\Delta p}{L_p^2} = -\frac{\tau g}{L_p^2}, \quad (1)$$

где знаки "+" и "-" относятся соответственно к областям $-d \leq x < 0$ и $0 < x \leq d$, L_p — диффузионная длина дырок, τ — время жизни неравновесных носителей заряда (τ , как и L_p , принимается не зависящим от координаты), g — функция генерации photoносителей, которую для простоты будем считать

постоянной в образце, T — температура, e — модуль заряда электрона, k — постоянная Больцмана. При записи (1) предполагалось, что концентрация photoносителей намного ниже концентрации равновесных электронов.

Уравнения (1) необходимо дополнить граничными условиями

$$\Delta p(\pm d) = 0, \quad (2)$$

соответствующими омическим kontaktам, а также условиями непрерывности концентрации photoносителей и их потоков в точке $x = 0$, где происходит смена знака dE_g/dx :

$$\Delta p(-0) = \Delta p(+0), \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \frac{d\Delta p}{dx} - \frac{1}{kT} \left(eE_x + \left| \frac{dE_g}{dx} \right| \right) \Delta p &\Big|_{x=-0} \\ = \frac{d\Delta p}{dx} - \frac{1}{kT} \left(eE_x - \left| \frac{dE_g}{dx} \right| \right) \Delta p &\Big|_{x=+0}. \end{aligned} \quad (4)$$

Определив из (1)–(4) координатную зависимость концентрации photoносителей, можно рассчитать КФУ варизонного ФР (равного, по определению, числу протекающих во внешней цепи электронов, приходящихся на один поглощенный фотон):

$$G = \frac{(\mu_n + \mu_p)|E_x|}{4d^2g} \int_{-d}^d \Delta p(x) dx = \frac{2|\bar{E}|}{\bar{d}^2} G_0^{\max} \left[\bar{d} + 2\delta \left(1 - \frac{f_1}{f_0} \right) - \frac{f_2}{2f_0} \right], \quad (5)$$

где

$$\bar{d} = d/L_p, \quad \bar{E} = eE_x L_p / 2kT, \quad \delta = L_p |\nabla E_g| / 2kT,$$

$$\begin{aligned} f_0 &= (\alpha_2 - \alpha_1)(k'_1 \alpha'_1 - k'_2 \alpha'_2) - (\alpha'_2 - \alpha'_1)(k_1 \alpha_1 - k_2 \alpha_2), \\ f_1 &= \alpha_1 \alpha_2 (\alpha'_1 - \alpha'_2)(k_1 - k_2) - \alpha'_1 \alpha'_2 (\alpha_1 - \alpha_2)(k'_1 - k'_2), \\ f_2 &= (\alpha_2 - \alpha'_1)(\alpha_1 - \alpha'_2)(k'_1 k_2 + k_1 k'_2) \\ &+ (\alpha_1 - \alpha'_1)(\alpha'_2 - \alpha_2)(k_1 k'_1 + k_2 k'_2) - 2(\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha'_1 - \alpha'_2), \end{aligned}$$

$$k_{1,2} = \bar{E} + \delta \pm \sqrt{(\bar{E} + \delta)^2 + 1}, \quad k'_{1,2} = \bar{E} - \delta \pm \sqrt{(\bar{E} - \delta)^2 + 1},$$

$$\alpha_{1,2} = \exp(-k_{1,2}\bar{d}), \quad \alpha'_{1,2} = \exp(k'_{1,2}\bar{d}).$$

Ввиду симметричности рассматриваемых ФР, достаточно проанализировать особенности КФУ для одного направления электрического тока; для конкретности будем считать, что $\bar{E} > 0$. Из (5) следует, что при $\bar{E} \ll \delta$ КФУ пропорционален приложенному напряжению, причем при $\delta \gg 1$, \bar{d}^{-1}

$$G = \frac{2\bar{E}}{\bar{d}^2} G_0^{\max} \left[\bar{d} - 4\delta^3 \exp(-2\delta\bar{d}) \right]. \quad (6)$$

В отличие от однородных ФР, в которых зависимость $G(\bar{E})$ линейна лишь в слабых электрических полях ($\bar{E} \ll 1$) [1], в варизонных ФР с большими градиентами E_g ($\delta \gg 1$, \bar{d}^{-1}) линейный участок $G(\bar{E})$ имеет существенно большую протяженность; при этом, ввиду малости второго слагаемого в (6), наклон полевой зависимости КФУ обратно пропорционален \bar{d} и практически не зависит от δ .

Для случая сильных электрических полей $\bar{E} \gg \delta$, \bar{d}^{-1} из (5) можно получить с точностью до членов порядка δ/\bar{E} следующее выражение для КФУ:

$$G = G_0^{\max} \left[1 + \left(\frac{1}{2} - \frac{\bar{d}}{3\delta} \right) \frac{\delta}{\bar{E}} \right], \quad (7)$$

из которого следует, что в сильных электрических полях $G(\bar{E})$ асимптотически приближается к G_0^{\max} , уменьшаясь с ростом \bar{E} при $\delta > 2\bar{d}/3$. Это означает, что полевые зависимости КФУ варизонных ФР могут иметь немонотонный характер с максимальным значением КФУ G^{\max} , превышающим максимальное значение КФУ однородных ФР G_0^{\max} . Расчеты по формуле (5) показывают, что с ростом δ коэффициент G^{\max} увеличивается, а положение максимума зависимости $G(\bar{E})$ сдвигается в сторону больших полей (рис. 1 и 2, a).

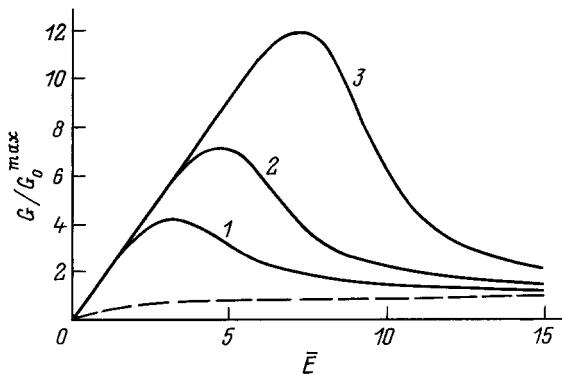


Рис. 1. Полевая зависимость коэффициента фотоэлектрического усиления варизонных (сплошные линии) и однородных (штриховая кривая) фоторезисторов. Нормированная длина $\bar{d} = 1$; значения параметра δ : 1 — 5, 2 — 7, 3 — 10.

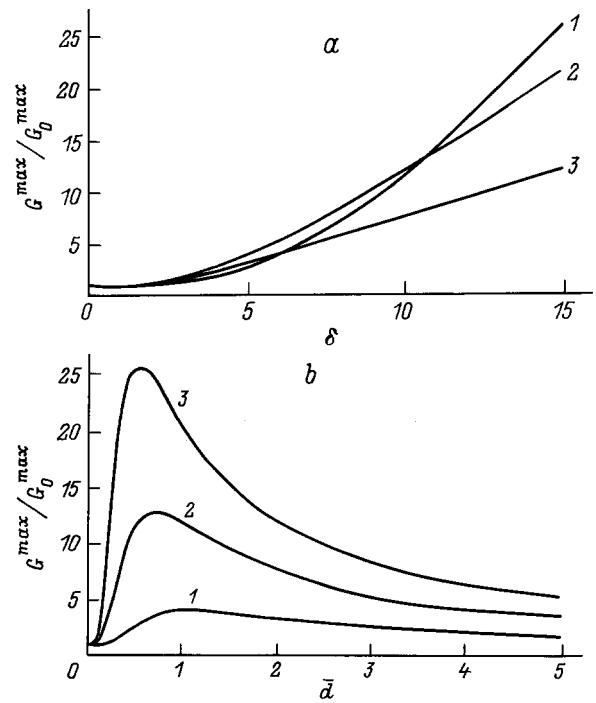


Рис. 2. Зависимость максимального значения коэффициента фотоэлектрического усиления варизонных фоторезисторов от градиента ширины запрещенной зоны (a) и расстояния между контактами (b). Параметры расчета принимают значения \bar{d} (рис. a): 1 — 0.5, 2 — 1, 3 — 2; δ (рис. b): 1 — 5, 2 — 10, 3 — 15.

Повышение фоточувствительности рассматриваемых варизонных ФР по сравнению с однородными обусловлено присутствием в первых внутреннего квазиэлектрического поля [9], которое оттягивает фотоносители к середине варизонной структуры, препятствуя таким образом их диффузионному, а также дрейфовому (во внешнем электрическом поле) смещению к омическим kontaktам. Диффузионный уход фотоносителей в контакты, который ведет к уменьшению τ_{eff} , возрастает с уменьшением расстояния между контактами, особенно при $\bar{d} \lesssim 1$. Поэтому для эффективного противодействия диффузии фотоносителей с уменьшением \bar{d} должен увеличиваться $|\nabla E_g|$. Сопоставляя времена диффузии и дрейфа в квазиэлектрическом поле на расстояние \bar{d} , легко показать, что в случае тонких образцов с $\bar{d} < 1$ варизонность заметно сказывается на фоточувствительности ФР (увеличивая ее в 2 и более раз при малых напряжениях смещения) при выполнении условия $\delta > \bar{d}^{-1}$. Отметим, что это неравенство, совместимое с неравенством $\delta > 2\bar{d}/3$, определяет область значений $|\nabla E_g|$, при которых $G^{\max} > G_0^{\max}$.

При фиксированном значении $|\nabla E_g|$ зависимость $G^{\max}(\bar{d})$ является немонотонной (рис. 2, b). Вначале рост \bar{d} приводит к возрастанию G^{\max} , что связано с увеличением τ_{eff} в результате возрастания времени

диффузионно-дрейфового смещения photoносителей к контактам. С приближением τ_{eff} к объемному времени жизни τ зависимость $G^{\max}(\bar{d}) \sim \tau_{\text{eff}}(\bar{d})/\tau_E(\bar{d})$ определяется главным образом временем пролета photoносителей во внешнем электрическом поле $\tau_E = \tau \bar{d}/\bar{E}$, т. е. уменьшается с увеличением \bar{d} .

В заключение оценим влияние варизонности на КФУ фоторезистора, изготовленного на основе эпитаксиальных слоев CdHgTe *n*-типа проводимости. Если принять $T = 77\text{ K}$, $d = L_p = 17\text{ мкм}$ [5,6], то при $E_g(0) = 0.1\text{ эВ}$, $E_g(d) = 0.3\text{ эВ}$ (что соответствует $\delta = 15$) максимальное значение коэффициента фотоэлектрического усиления, достигаемое при $E_x = 90\text{ В/см}$, в 20 раз больше, чем в случае однородных образцов.

Список литературы

- [1] R.L. Williams. Infr. Phys., **8**, 337 (1968).
- [2] C.B. Burgett, R.L. Williams. Infr. Phys., **13**, 61 (1972).
- [3] M.R. Johnson. J. Appl. Phys., **43**, 3090 (1972).
- [4] T. Ashley, C.T. Elliott. Infr. Phys., **22**, 367 (1982).
- [5] D.L. Smith, D.K. Arch, R.A. Wood, M. Walter Scott. Appl. Phys. Lett., **45**, 83 (1983).
- [6] D.K. Arch, R.A. Wood. J. Appl. Phys., **58**, 2360 (1985).
- [7] О.Г. Кондратьева, Л.Н. Неустроева, В.В. Осипов. ФТП, **22**, 2131 (1988).
- [8] О.Г. Кондратьева, Л.Н. Неустроева, В.В. Осипов. ФТП, **23**, 536 (1989).
- [9] О.В. Константинов, Г.В. Царенков. ФТП, **10**, 720 (1976).
- [10] В.Г. Савицкий, Б.С. Соколовский. УФЖК, **25**, 1919 (1980).

Редактор Т.А. Полянская

On photoelectric amplification of variband photoresistors

V.G. Savitsky, B.S. Sokolovsky

I. Franko State University,
290602 Lvov, Ukraine

Abstract Characteristic features of the photoelectric amplification of variband photoresistors, the energy gap of which increases linearly towards contacts have been considered theoretically. It has been shown that non-monotonic field dependence of the photoelectric amplification coefficient is peculiar to such photoresistors. A maximum value of the photoelectric amplification coefficient increasing with the energy gap gradient can be considerably greater than that for homogeneous samples.